STM 中各种金属针尖 / 基底组合下的蒸发场强计算¹

李志扬 刘武

(华中师范大学物理系 武汉 430079)

摘 要 稍前通过引入有效结合能的概念,本文作者重新建立了扫描隧道显微镜的蒸发场强公式,并计算了 若干同种金属针尖与金属基底组合下的蒸发场强,本文进一步给出了更多的计算实例,特别是重点讨论了异种 金属针尖与金属基底组合下的蒸发场强计算,为了确定不同针尖样品间距时的有效结合能,本文提出了一个普 适函数,来描述吸附原子离金属基底不同距离时的原子势能曲线.

关键词 STM, 有效结合能, 蒸发场强

中图号 0462.4

1概述

近年来扫描隧道显微镜 (STM) 中的场蒸发受到人们的广泛关注,通过强电场可把金属针 尖上的原子场蒸发到金属、半导体基底上,或从这些基底上移走原子,从而在基底上制作出纳 米尺寸的原子堆或原子坑^[1-6]。但人们发现在 STM 中进行场蒸发,所需电场比场离子显微镜 (FIM) 中低得多,所观察到的场蒸发速率也比 FIM 中高很多。这是因为在 STM 中由于针尖与 样品相距非常近,被蒸发原子不仅受到发射电极上原子的作用,同时也受到对电极上原子的作 用,这样大大降低了蒸发场强。因而有人称 STM 中场蒸发为化学辅助场蒸发。传统的电荷交 换 (CE) 模型和成像势垒 (IE) 模型不能正确地描述 STM 中的场蒸发现象,它们给出的理论计 算值比实验测量值要高出几倍^[7]。我们曾根据 STM 的场蒸发的特点,引入了有效结合能的概 念,并借用 Forbes 定义的标准势能,对 STM 场蒸发过程进行了电热动力学分析,从而建立了 STM 的蒸发场强计算公式,首次得到了与实验吻合的计算结果^[8,9]。根据新建立的公式我们曾 详细讨论了若干同种金属针尖 / 金属基底组合时的蒸发场强计算,本文进一步给出了更多的计 算实例,特别是重点讨论了异种金属针尖 / 金属基底组合时的蒸发场强计算,本文进一步给出了更多的计 算实例,特别是重点讨论了异种金属针尖 / 金属基底组合时的蒸发场强计算。在实验中人们使 用最多的是 Au 基底,因此在下面的实际计算中,我们主要考虑 Cu,Ag,W 等几种金属针 尖在 Au 基底上的蒸发场强。为了计算方便,本文首先将引入一个普适函数来描述吸附原子在 离异种金属基底不同距离时的原子势能曲线。

2 普适函数与有效结合能

在 STM 中由于针尖与样品相距非常近,被蒸发原子与发射电极上原子相互作用以及与对 电极上原子的相互作用的原子势能曲线相互交叠,形成一个双势阱结构,如图 1 所示。一个中 性原子要从发射电极热激发到对电极,所需越过的势垒高度为 Λ_{eff},它就是我们所定义的有效 结合能。要计算在不同针尖与样品间距时的 Λ_{eff},可分别计算出被蒸发原子单独与发射电极 以及对电极上原子之间的原子势能曲线,然后再叠加确定总原子势能曲线进行求解。下面先用 Gollish 提出的 EBPM 法计算吸附原子与异种金属基底间的原子势能曲线。在 EBPM 法中,原 子势能定义为^[10]

$$Ua = \sum_{i \neq j} \sqrt{b_{A(i)}} \sqrt{b_{A(j)}} \Theta_{A(i)}(r_{ij}) \Theta_{A(j)}(r_{ij}) - \left| \sum_{i \neq j} \sqrt{a_{A(i)}} \sqrt{a_{A(j)}} \Phi_{A(i)}(r_{ij}) \Phi_{A(j)}(r_{ij}) \right|^{\mu}$$
(1)

^{1 1999-07-20} 收到, 1999-10-14 定稿



图 1 STM 中原子势能曲线示意图 (E_a 表示原子势能,发射电极与对电极分别位于 x = 0 和 x = d)

其中 $\Theta_{A(i)}(r_{ij}) = [Q_{AA}(r_{ij})]^{S\mu\lambda_A/2}$, $\Phi_{A(i)}(r_{ij}) = [Q_{AA}(r_{ij})]^{\lambda_A/2}$, A(i) 表示原子种类, a. b, λ . 是由原子种类确定的参数。常数 μ 为 0.6 , $S = \mu/2$ 。 $Q(r_{ij})$ 表示位于 r_i 与 r_j 的原子 之间的相互作用,

$$Q(r_{ij}) = \int \rho_i(r)\rho_j(r)\mathrm{d}r \tag{2}$$

Gollisch 所使用的球对称原子电荷密度函数 $\rho(r)$ 是由相对论 Kohn-Sham 方程求得,其中交换 关联能采用 $X\alpha$ 近似。

图 2(a)-2(d) 是计算的 Au, Cu, Ag 和 W 原子离 Au(100) 表面不同距离的原子势能曲 线。对吸附原子与同种金属基底间的原子势能曲线我们曾提出,把它们归一化后可用如下的普 适函数来描述^[8]:

$$E_a(x) = E_a(x_0)[1 + \beta(x - x_0)/L] \exp[-\beta(x - x_0)/L]$$
(3)

式中 x_0 为平衡位置, L 为 Thomas-Fermi 屏蔽常数, $\beta=0.75$ 。图 2(a)- 2(d) 按 (3) 式归一化 后的结果如图 3 所示。可见 (3) 式同样可以用来描述吸附原子与异种金属基底间的原子势能曲 线。以此为基础,进一步计算的 Cu, Ag 和 W 针尖与 Au(100) 基底不同间距时的有效结合能 Λ_{eff} 如图 4 所示。从图中可以看出,当针尖基底间距减小时,有效结合能迅速减小。而当大于 1.3mm 以后,有效结合能趋近于金属针尖的结合能。

3 蒸发场强计算

我们建立的 STM 蒸发场强计算公式如下 [8,9]:

$$F = \frac{1}{ner_0} [\Lambda_{\text{eff}} + \sum_{i=1}^{n} I_i - n\Phi - \eta_n(r_0) - KT \ln(\nu/\kappa)]$$
(4)

式中 Λ_{eff} 为有效结合能, I_i 为第 i 电离能, Φ 为功函数, n 为离子价态, $\eta_n(r_0)$ 为化学势, r_0 为离子半径, K 为玻耳兹曼常数, T 为绝对温度, κ 为场蒸发速率, ν 为原子振荡频率。 对负离子,上式中的 $\sum I_i - n\Phi$ 应换为 $n\Phi - \sum E_{\text{aff},i}$, 其中 $E_{\text{aff},i}$ 为原子的电子亲和势. 电



根据 (4) 式计算的 Au, Cu, Ag 和 W 针尖离 Au(100) 基底不同间距时的蒸发场强如图 5 所示。计算中取 $\kappa = 10^{11}$ /s,且 T=300K。从图中可以看出,当针尖基底间距大于 1.3nm 以 后,STM 中蒸发场强趋近于 FIM 中的蒸发场强。而当针尖基底间距减小时,蒸发场强迅速减 小,这与实验观察相一致。

4 结 论

本文用 EBPM 方法计算了吸附原子与异种金属基底间的原子势能曲线,发现它们可用一个 普适函数来表示。我们进一步计算了不同针尖与基底间距时的有效结合能和蒸发场强。当针尖 与基底间距减小时,有效结合能迅速减小,从而导致蒸发场强迅速减小。



图 5 不同价态金属离子在 Au(100) 基底上的蒸发场强随针尖基底间距的变化

参考文献

- H. J. Mamin, P. H. Guethner, D. Rugar D, Atomic emission from a scanning tunneling microscope tip, Phys. Rev. Lett., 1990, 65(19), 2418-2421.
- [2] G. S. Hsiao, R. M. Penner, J. Kingsley, Deposition of metal structures onto Si(111) surface by field evaporation in the scanning tunneling microscope, Appl. Phys. Lett., 1994, 64(11), 1350–1352.
- [3] C. S. Chang, W. B. Su, T. T. Tsong, Field evaporation between a gold tip and a surface in the scanning tunneling microscope configuration, Phys. Rev. Lett., 1994, 72(4), 574–577.
- [4] F. Grey, D. H. Huang, A. K. Koayashi, E. J. Snyder, Time-resolved atomic scale modification of silicon with a scanning tunneling microscope, J. Vac. Sci. Technol. B, 1994, 12(3), 1901–1905.
- [5] 李志扬,刘 武,黄光明,李兴教,大气环境下 STM 金针尖场蒸发纳米书写实验研究,电子显微学报, 1997, 16(6),787-788.
- [6] 李志扬,刘武,李兴教,压电陶瓷扫描管在纳米加工中的应用,压电与声光, 1998,20(1),25-27.
- [7] T. T. Tsong, Effect of an electric field in atomic manipulation, Phys. Rev. B, 1991, 44(10). 13703-13710.
- [8] Zhiyang Li, Wu Liu, Xingjiao Li, Field evaporation in the configuration of a scanning tunneling microscope, Ultramicroscopy, 1998, 73(1), 147–155.
- [9] Zhiyang Li, Wu Liu, Xingjiao Li, An electrothermodynamic analysis of field evaporation in the configuration of a scanning tunneling microscope, Chinese Physics Letters, 1998, 15(8), 608–610.
- [10] Gollisch, Surf. Sci. 1986, 166(1), 87-96.

CALCULATION OF EVAPORATION FIELDS FOR VARIOUS TIP/SUBSTRATE COMBINATIONS IN THE CONFIGURATION OF A SCANNING TUNNELING MICROSCOPE

Li Zhiyang Liu Wu

(Department of Physics, Huazhong Normal University, Wuhan 430079, China)

Abstract An effective binding energy and a formula for evaporation fields in the configuration of a scanning tunneling microscope has been introduced. Based on which, evaporation fields for various tip/substrate combinations, especially those for non-identical tip/substrate combinations have been calculated. To do this a universal function for atomic potential of an adatom at different distances from a metal surface is proposed.

Key words STM, Effective binding energy, Evaporation field

- 李志扬:
 男、1964年生,博士,副教授,近年来的研究方向主要在扫描探针显微镜(SPM)仪器研制、基丁SPM
 的纳米加工技术以及纳米器件等。1992年曾在国内率先报道了有关光子扫描隧道显微镜的研制,近年来在
 STM场蒸发理论和实验以及近场光学理论方面取得一系列进展,并获得一项单电子器件国家专利.
- 刘 武: 男, 1941年生,教授,博士生导师, 1986年从美国滨州大学 Euller 场发射实验室访问研究回国后,主持研制了国内首套综合性能居世界先进水平的 FEM-FIM-APFIM 实验系统,利用该系统在固体微观结构直接测定,金属表面化学催化、化学反应中间生成物测定、负离子谱研究等方面取得一系列成果,其中负离子谱技术已获得国家专利.